DIN CEN/TS 15605:2008-02 (D)

Kupfer und Kupferlegierungen - Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung; Deutsche Fassung CEN/TS 15605:2007

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 6

3 Kurzbeschreibung ... 7

4 Reagenzien und Stoffe ... 7

5 Gerät ... 12
5.1 Übliche Laboratoriumsausstattung ... 12

6 Probenahme ... 12

7 Durchführung ... 12
7.1 Verfahren A: Kupfer ... 12
7.2 Verfahren B: Kupfer-Zink-Legierungen ... 16
7.3 Verfahren C: Kupfer-Zinn-Legierungen ... 20
7.4 Verfahren D: Kupfer-Aluminium-Legierungen ... 24
7.5 Verfahren E: Kupfer-Beryllium-Legierungen ... 28
7.6 Verfahren F: Kupfer-Nickel-Legierungen ... 32
7.7 Verfahren G: Kupfer-Blei-Zinn-Legierung ... 36

8 Angabe der Ergebnisse ... 40

9 Präzision ... 41
9.1 Verfahren B — Kupfer-Zink-Legierungen ... 41
9.2 Verfahren C — Kupfer-Zinn-Legierungen ... 42
9.3 Verfahren D — Kupfer-Aluminium Legierungen ... 43
9.4 Verfahren F — Kupfer-Nickel-Legierungen ... 44
9.5 Verfahren G — Kupfer-Blei-Zinn-Legierung ... 44

10 Prüfbericht ... 44

Anhang A (informativ) Optisches Emissionsspektrometer (OES) — Zur Überprüfung vorgeschlagene Leistungskriterien ... 45

Literaturhinweise ... 47